

Técnicas de caracterización de materiales y dispositivos semiconductores

Microcredencial 6 ECTS (30h aula + 30h laboratorio)

CÁTEDRA UPM – INDRA en MICROELECTRÓNICA

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Caracterización de Materiales

- a) Difracción mediante rayos X (XRD)
- b) Microscopía electrónica de barrido (SEM)
- c) Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM)
- d) Fotoluminiscencia (PL)
- e) Espectroscopía Raman

2. Caracterización de Dispositivos

- a) Medidas de Electroluminiscencia
- b) Medidas de Fotocorriente
- c) Análisis de la transmitancia y la reflectancia en el infrarrojo, ultravioleta y visible.
- d) Medidas de transporte (corriente-tensión, capacidad-tensión)



**MATRÍCULA 100%
GRATUITA,
FINANCIADO POR
CÁTEDRA
UPM-INDRA**

 Del 06/05/2025 al 10/07/2025 (M y J de 17:00h a 20:00h)

 PRESENCIAL. Laboratorios del ISOM y aulas de la ETSI Telecomunicación

 comunidad.microelectronica@upm.es

PREINSCRÍBETE